

# ICI E450 L-EFT

Puls-E-Feldquelle



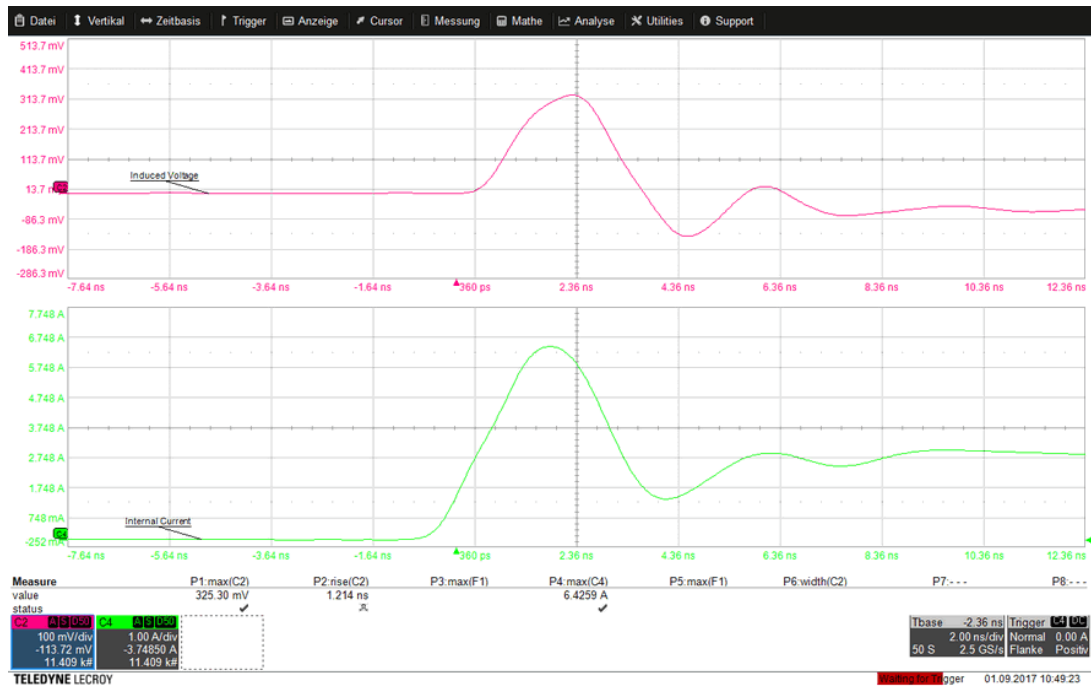
## Kurzbeschreibung

Die elektrische Impulsfeldquelle ICI E450 L-EFT koppelt schnelle Einschwingimpulse in einen Test-IC (offener Chip). Dies ermöglicht eine Fehlerinduktion (fault injection) oder das Testen der Immunität einzelner Bereiche des IC.

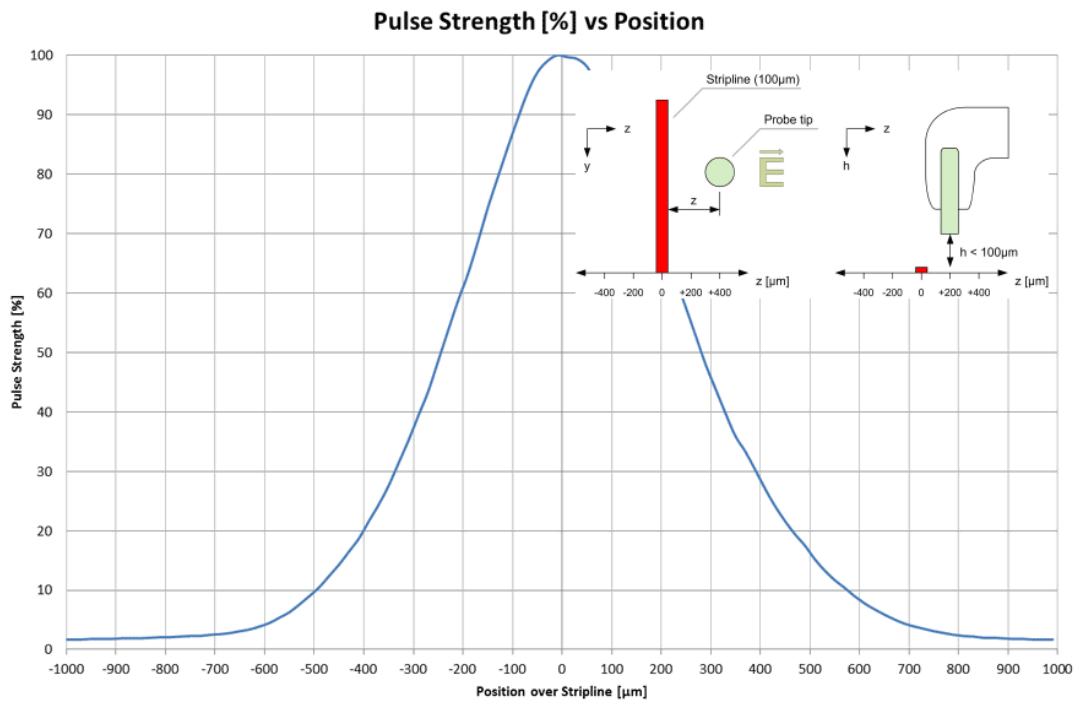
## Technische Parameter

<b>Maße Sondenkopf</b>	Ø 450 µm
<b>Max. Verschiebungsstrom (Stripline 100 µm)</b>	7 mA
<b>Pulsparameter</b>	
Anstiegszeit	< 2 ns
Wiederholfrequenz	0.1 Hz - 20 kHz
Polarität (Software gesteuert)	+ / - / alternating
<b>Messausgang</b>	50 Ω
<b>Trigger Puls Verzögerung (Bypass Modus - Delay Line)</b>	
min. Trigger Puls Verzögerung (typ.)	70 ns
max. Trigger Puls Verzögerung (typ.)	420 ns
max. Jitter (typ.)	± 1 ns
<b>Versorgung</b>	BPS 202
<b>Gewicht</b>	70 g
<b>Maße (L x B x H)</b>	(26 x 43 x 53) mm

Pulsform



Querscan



# ICI E450 L-EFT

Puls-E-Feldquelle

Puls E-Feldquelle ICI E450 L-EFT in Anwendung

